

有機ELディスプレイの総合評価

構造把握・材料評価・劣化原因特定など各種手法を組み合わせることで評価します

測定法 : FT-IR・TEM・TOF-SIMS・LC/MS

製品分野 : 照明・ディスプレイ

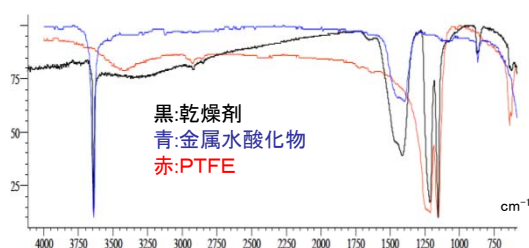
分析目的 : 組成評価・同定・化学結合状態評価・形状評価・膜厚評価・不良解析・劣化調査・製品調査

概要

有機ELは、自発発光するフレキシブルな次世代ディスプレイ、照明パネルとして期待されていますが、更なる信頼性の向上が望まれています。各種手法を組み合わせることにより、構造解析や状態分析および劣化原因の特定などの総合評価が可能です。

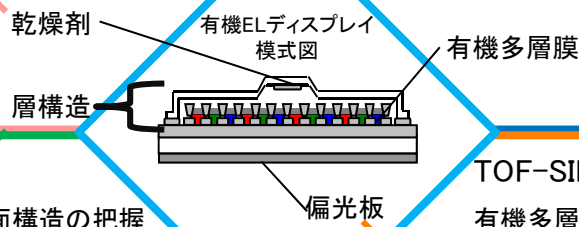
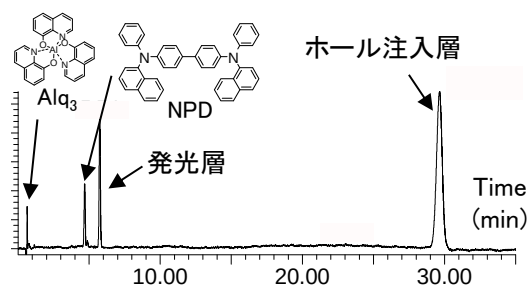
データ

FT-IR 乾燥剤、偏光板、接着剤などの状態分析および主成分の同定



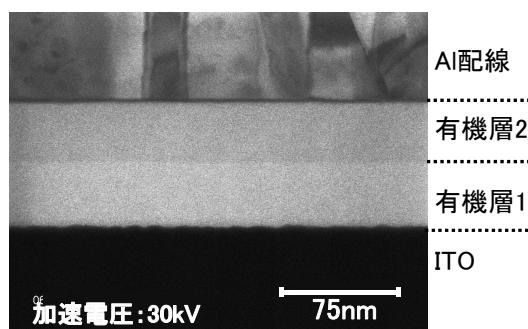
LC-MS 有機多層膜中の微量成分を同定

詳細は技術資料 C0133参照



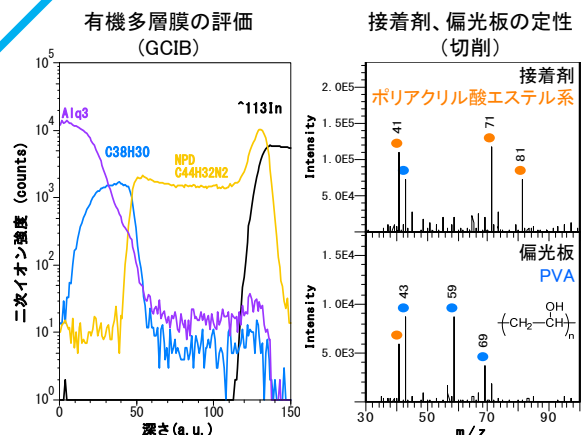
低加速STEM

有機多層膜を含めた断面構造の把握



TOF-SIMS

有機多層膜の定性・劣化評価 (GCIB)
接着剤・偏光板の定性 (切削)



分析サービスで、あなたの研究開発を強力サポート！

一般財団法人
MIST 材料科学技術振興財団

TEL : 03-3749-2525 E-mail : info@mst.or.jp

URL : <http://www.mst.or.jp/>